

## Title (en)

Device for testing and sorting electronic compounds such as IC's.

## Title (de)

Vorrichtung zum Testen und Sortieren von elektronischen Bauelementen, insbesondere IC's.

## Title (fr)

Dispositif pour l'essai et le classement d'éléments électronique en particulier IC's.

## Publication

**EP 0268881 A1 19880601 (DE)**

## Application

**EP 87116152 A 19871103**

## Priority

DE 3638430 A 19861111

## Abstract (en)

A device for testing and sorting electronic components (33), in particular ICs, is mounted directly on the holding device (2a, 2b to 10a, 10b) which is preferably associated with a manipulator for a testing computer. To transport the components (33) between an input magazine (16), a test head (20) and an output magazine (17), a suction head (20) is provided which can be transported on a carriage guide (15) and which is mounted so as to be capable of being lowered. The holding device associated with the manipulator makes it possible to arrange the test computer (1) and the entire device at an angle in such a way that the components (33) move forward so as to slide under the force of gravity in the magazine sticks (26) of the input magazine (16) and of the output magazine (17). <IMAGE>

## Abstract (de)

Eine Vorrichtung zum Testen und Sortieren von elektronischen Bauelementen (33), insbesondere IC's ist direkt auf die vorzugsweise zu einem Manipulator gehörende Halterung (2a, 2b bis 10a, 10b) für einen Testcomputer aufgesetzt. Zum Transport der Bauelemente (33) zwischen einem Eingangsmagazin (16), einem Testkopf (20) und einem Ausgangsmagazin (17) ist ein Saugkopf (20) vorgesehen, der an einer Schlittenführung (15) verfahrbar und absenkbar angeordnet ist. Die zu dem Manipulator gehörende Halterung erlaubt eine schräge Anordnung des Testcomputers (1) und der gesamten Vorrichtung, derart, daß die Bauelemente (33) in den Magazinstangen (26) des Eingangsmagazins (16) und des Ausgangsmagazins (17) sich mittels Schwerkraft gleitend vorwärtsbewegen.

## IPC 1-7

**B07C 5/344**; **B07C 5/36**

## IPC 8 full level

**B07C 5/344** (2006.01); **B07C 5/36** (2006.01)

## CPC (source: EP US)

**B07C 5/344** (2013.01 - EP US); **B07C 5/36** (2013.01 - EP US)

## Citation (search report)

- [A] EP 0144715 A1 19850619 - UEBERREITER EKKEHARD
- [AD] EP 0102217 A1 19840307 - INTEST CORP [US]
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 84 (P-117)[962], 22. Mai 1982; & JP - A - 57 22570 (FUJITSU) 05.02.1982
- [Y] WERKSTATSTECHNIK, Band 76, Nr. 10, Oktober 1986, Seiten 585-589, Berlin; D. SCHELLENBERGER et al.: "Möglichkeiten und Trends bei der automatischen Werkstückhandhabung mit Industrierobotern"

## Cited by

CN106179991A; CN111792351A; CN106216265A

## Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

## DOCDB simple family (publication)

**EP 0268881 A1 19880601**; DE 3638430 A1 19880519; US 4908126 A 19900313

## DOCDB simple family (application)

**EP 87116152 A 19871103**; DE 3638430 A 19861111; US 11895787 A 19871110